#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С применением предложенных моделей проведено моделирование и исследование двух наиболее перспективных приборных структур наноэлектроники, в частности ПГТ и РТД на основе графена, в зависимости от различных факторов.

Предложенные модели включены в систему моделирования наноэлектронных приборных структур и устройств NANODEV [8, 9], разрабатываемую в БГУИР с 1995 года.

Работы проведены в рамках проектов Государственных программ научных исследований Республики Беларусь «Конвергенция» и «Нанотех».

#### ЛИТЕРАТУРА

- Novoselov K.S., Fal'ko V.I., Colombo, L., Gellert P.R., Schwab M.G., Kim K.SA roadmap for graphene // Nature. 2012. Vol. 490. P. 192–200.
- Ferrari A.C., Bonaccorso F., Fal'ko V., Novoselov K.S. et al.SScience and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems // Nanoscale. – 2015. – Vol. 7. – P. 4598-4810.
- 3. Абрамов, И.И. Основы моделирования элементов микро- и наноэлектроники / И.И. Абрамов. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 444 с.
- 4. Абрамов, И.И. Лекции по моделированию элементов интегральных схем / И.И. Абрамов. М. Ижевск: НИЦ РХД, 2005. 152 с.
- Абрамов, И.И. Лекции по моделированию элементов интегральных схем микроэлектроники / И.И. Абрамов. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 116 с.
- 6. Абрамов И.И., Коломейцева Н.В., Лабунов В.А., Романова И.А. Моделирование резонанснотуннельных диодов на основе графена на подложках различного типа // Нанои микросистемная техника. – 2015. – № 11. – С. 3-10.
- Wang H., Hsu A., Antoniadis D.A., Palacios T. Compact virtual-source current-voltage model for top- and back-gated graphene field-effect transistors // IEEE Trans. Electron. Dev. – 2011. – Vol. 58, No. 5. – P. 1523-1533.
- Абрамов И.И., Гончаренко И.А., Игнатенко С.А., Королев А.В., Новик Е.Г., Рогачев А.И. Система моделирования наноэлектронных приборов NANODEV // Микроэлектроника. 2003. Т. 32, № 2. – С. 124-133.
- Abramov I.I., Baranoff A.L., Goncharenko I.A., Kolomejtseva N.V., Bely Y.L., Shcherbakova I.Y. A nanoelectronic device simulation software system NANODEV: New opportunities // Proc. of SPIE. - 2010. - Vol. 7521. - P. 75211E-1-11.

# СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДА ДО И ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

# И. И. Азарко<sup>1</sup>, Г. А. Гусаков<sup>2</sup>, В. Б. Оджаев<sup>1</sup>, О. Н. Янковский<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Белорусский государственный университет <sup>2</sup>Научно-исследовательское учреждение "Институт прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко" Белорусского государственного университета

#### введение

Ультрадисперсные алмазы (УДА) детонационного синтеза относятся к классу наноматериалов с развитой поверхностью. Поэтому относительно легко с помощью химической или барометрической обработки им можно придать различные электронные свойства [1]. В связи с этим внимание исследователей сосредоточено на детальном изучении характеристик и свойств ультрадисперсных алмазов и на поиске новых областей их применения для различных отраслей промышленности, в том числе для наполнения и упрочнения композитных материалов с целью создания стабильной структуры [2].

Методом электронного парамагнитного резонанса было исследовано изменение параметров спектров ультрадисперсных алмазов после отжига на воздухе. Парамагнитные центры (ПЦ) регистрировались на ЭПР-спектрометре «Varian E-112» при комнатной и температуре жидкого азота. При комнатной температуре измерения регистрируется одиночный сигнал с g = 2,0019 с формой линии хорошо аппроксимируемой уравнением Лоренца и шириной линии до 7,6 Гс. Концентрация ПЦ, сответственно изменяется от  $2 \cdot 10^{17}$  до  $6 \cdot 10^{17}$  спин/г. Сигнал ЭПР не насыщается при повышении мощности СВЧ излучения вплоть до 150 мВт. При снижении температуры измерения до 77 К интенсивность сигнала увеличивается примерно на порядок. Форма линии сигнала остается лоренцевой. На рисунке представлена зависимость концентрации парамагнитных центров образцов УДА от температуры отжига.



Рисунок – Зависимость концентрации парамагнитных центров образцов УДА от температуры отжига

Как видно из рисунка, наблюдается падение концентрации парамагнитных центров при приближении к температурам Т $\geq$ 1000 С °, которое связано со спеканием кристаллов друг с другом и уменьшением количества оборванных связей. Ширина линии сигнала при этом практически не меняется и только при повышении температуры отжига до 1000 С ° происходит ее увеличение до 10 Гс, что может свидетельствовать об усиленном образовании дефектов при спекании частиц. Фазовый переход из графита в алмаз происходит под действием высокого давления в ударной волне. Структура частицы УДА состоит из упорядоченного кристаллоподобного ядра и не плотной оболочки. За основные свойства, близкие к характеристикам объемных кристаллов алмаза, отвечает именно центральная область частицы, периферийная же область определяет в первую очередь знак и величину поверхностного заряда, химический состав. Последний, в основном, определяется, как и для ядра, преобладанием атомов углерода. Вследствие активного взаимодействия разрыхленной оболочки с внешней средой, периферия частицы УДА обогащена кислород- и азотсодержащими дефектами. При увеличении температуры отжига может изменяться процентное со-

отношение алмазоподобной структуры, для которой характерна sp<sup>3</sup>- гибридизация и число фрагментов с графитоподобной структурой с sp<sup>2</sup>- гибридизацией. Вследствие чего может увеличиваться область перехода от центрального ядра с алмазной кристаллической решеткой к аморфной периферии. Различные дефекты на поверхности и внутри частиц УДА, в том числе искажения структуры алмазного ядра определяют парамагнитные свойства образцов. Несмотря на высокую концентрацию азота в УДА триплетный сигнал Р1 центров не наблюдается, т.к. из за высокой скорости образования кристалла входящие в ароматический цикл компоненты встраиваются в углеродную матрицу скорее не как одиночные атомы, а в виде азот-углеродной пары [2].

#### ЛИТЕРАТУРА

- Prasad B.L.V. et al. Heat-treatment effect on the nanosized grafphite pi-electron system during diamond to graphite conversion // Physical Rev. B – 2000 – V. 62, №16. P11209-11218.
- Долматов В.Ю. Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза: свойства и применение // Успехи химии. 2001, том. 70, Вып. 7.–с. 687-708.

## ФОНОННЫЕ СВОЙСТВА МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СЛОЕВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ МоS<sub>2-x</sub>Te<sub>x</sub>

### А. Ю. Алексеев, А. В. Кривошеева, В. Л. Шапошников, В. Е. Борисенко

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, lucky.alexey94(@gmail.com

Моделирование из первых принципов фононных свойств двумерных кристаллов твердых растворов  $MoS_{2-x}Te_x$  показало, что с увеличением концентрации теллура рамановские частоты мод, типичные для  $MoS_2$ , уменьшаются, а на частоты мод, типичные для  $MoTe_2$ , состав твердого раствора оказывает слабое влияние.

Обнаружение необычных электронных свойств графена явилось стимулом к изучению свойств различных двумерных кристаллов. Среди них наибольший научный и практический интерес представляют двумерные кристаллы дихалькогенидов тугоплавких металлов (ДТМ) [1], структура которых схожа со структурой графита, в котором отдельные слои графена связаны друг с другом слабо, а связь между атомами одного слоя сильна. ДТМ образуют слоистые структуры вида X-Me-X, где X - атом халькогена, а Ме – атом тугоплавкого металла, при этом плоскость из атомов металла расположена между двумя плоскостями из атомов халькогена. Связь между отдельными слоями Х-Ме-Х осуществляется за счет слабых сил Ван-дер-Ваальса. Для некоторых ДТМ, в частности дихалькогенидов молибдена и вольфрама, являющихся непрямозонными полупроводниками в объемном состоянии, характерно превращение в прямозонные полупроводники с шириной запрещенной зоны 1-2 эВ при понижении размерности до одного мономолекулярного слоя [1], что открывает широкие возможности их применения в электронике и оптоэлектронике [2]. Разработаны технологические основы получения качественных однородных мономолекулярных слоев ДТМ на промышленно используемых подложках [3]. Также была продемонстрирована возможность синтеза одного или нескольких мономолекулярных слоев твердых растворов ДТМ с целью создания структур с настраиваемыми электронными и оптическими свойствами [4].